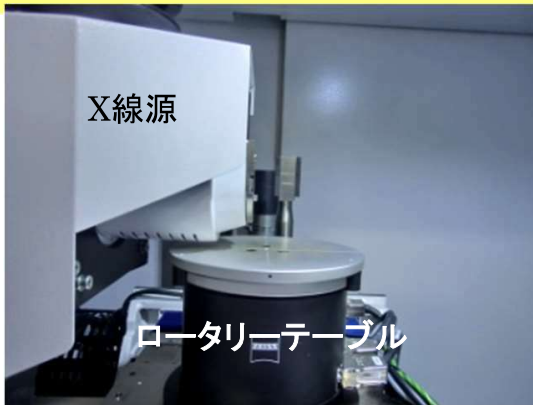
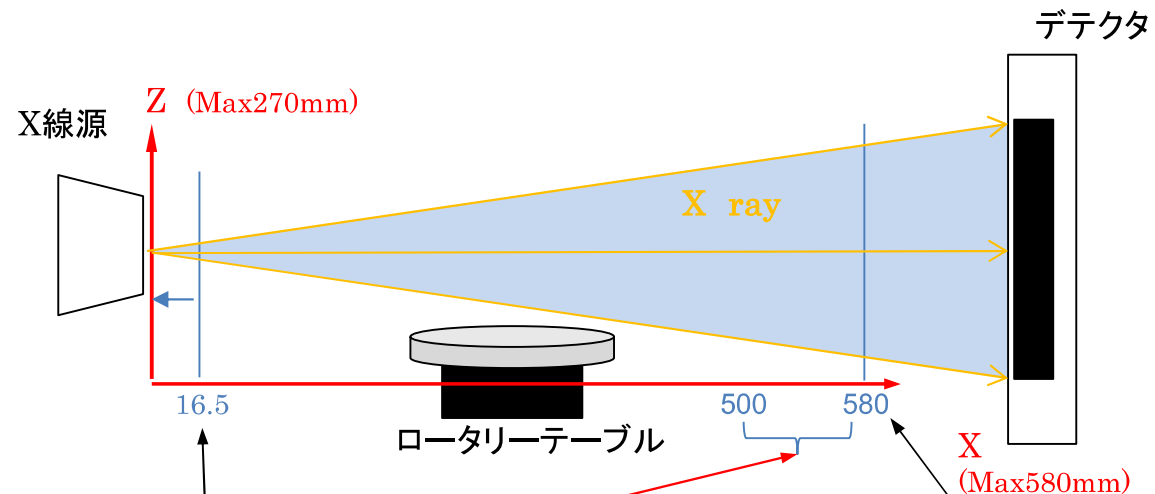


測定機内の環境について

測定位置
X 16.5mm
Z 270mmのとき



衝突注意！



X
解像度 ~16.5mmのとき
5 μ m
測定範囲 縦9mm 横7mm

注意: X>500mmのとき、Z<240の高さに設定してください(ポジションエラーになり、機器が停止します。)

X
解像度 580mmのとき
94 μ m
測定範囲 縦170mm 横135mm

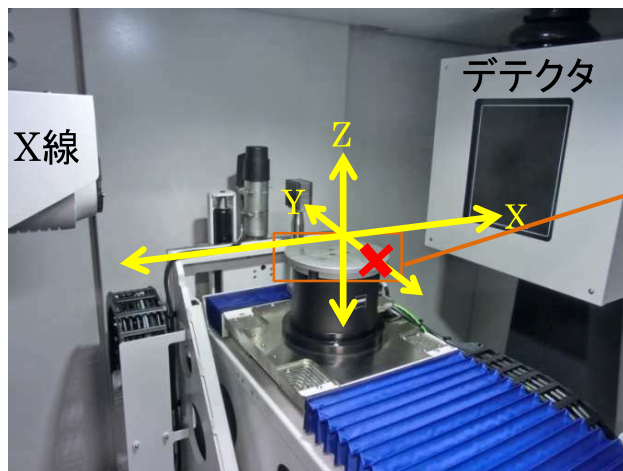
X座標値と解像度(ボクセルサイズV_x)の特性表

X[mm]	16.5	20	30	40	50	60	80	100	200	300	500	580
V _x [μ m]	5	6	7	9	10	12	15	18	34	50	81	94

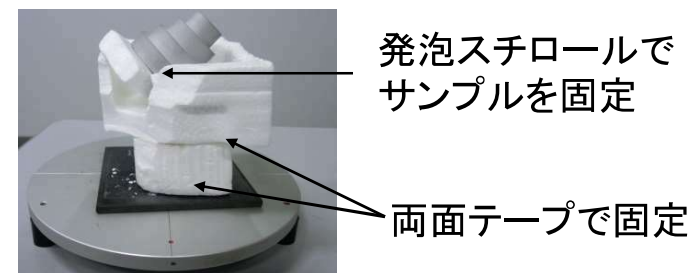
X線源からの距離に応じて、解像度(ボクセルサイズ)、測定範囲が変わる。
近づければ解像度が小さくなる(細かく撮れる)が、測定範囲も小さい。遠ざければ解像度は大きくなる(粗くなる)が測定範囲は大きくなる。

基本的に測定対象ができるだけ大きくデテクタに投影されるように、X線源に近づく。

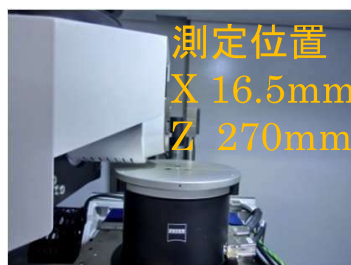
X線CT三次元測定機内 試料台の周辺環境



駆動範囲 X~580mm
Z~270mm Yは固定



通常マグネットを利用して、金属片等で試料台と治具(サンプル)を固定
→試料台はY方向に動かせないため、測定位置の調整(ずらす)に便利。



測定条件
X ~16.5mmのとき
解像度 $5\mu\text{m}$
測定範囲 縦9mm 横7mm
X 580mmのとき
解像度 $94\mu\text{m}$
測定範囲 縦170mm 横135mm

サンプルサイズ(治具含む) ~ $\Phi 240 \times 300\text{mm}$ 程度

